



Seminario

Materiales escala nano mediante perfilometría óptica 3D

Pro-Lite Technology Iberia, junto con su socio tecnológico Sensofar Metrology, le invitan a participar en la jornada de "**Materiales escala nano mediante perfilometría óptica 3D**". Esta jornada va dirigida a todos aquellos que utilizan o estén pensando en utilizar perfilometría óptica para la caracterización de materiales y que deseen conocer las nuevas tendencias en este campo.

Programa

- 9:45** Entrega acreditaciones
- 10:00** Introducción
- 10:30** Técnicas de metrología óptica: Confocal, Interferometría y Variación de Foco
- 11:00** Nuevos métodos de medida y hardware: confocal continuo y variación confocal
- 11:30** Aplicaciones
- 12:00** Fin de la jornada



21 Junio 2017



Ubicación:

I.U.I. Nanophotonics Technology Center
Universitat de Valencia
Building 8F Access K
Camino de Vera, s/n
46022 - Valencia



Regístrese en
info@pro-lite.es

Organizadores

PRO-LITE
TECHNOLOGY

SENSOFAR.
METROLOGY



Centro de Tecnología Nanofotónica de Valencia